IEC 60172

Edition 3.0 2010-01

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

AMENDMENT 2
AMENDEMENT 2

Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled winding wires

Méthode d'essai pour la détermination de l'indice de température des fils de bobinage émaillés

Withdrawn
IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010

IEC 60172:1987/A2:2010

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2010 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.
If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.
Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub
The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,…). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.
- IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub
Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.
- Electropedia: www.electropedia.org
The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.
- Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv
If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:
Email: csc@iec.ch
Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm
Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,…). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.
- Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub
Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.
- Electropedia: www.electropedia.org
Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.
- Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm
Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:
Email: csc@iec.ch
Tél.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010
Withdrawn

IEC 60172

Edition 3.0 2010-01

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

AMENDMENT 2
AMENDEMENT 2

Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled winding wires

Méthode d'essai pour la détermination de l'indice de température des fils de bobinage émaillés

Withdrawn
IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX F

ICS 29.060.10

ISBN 978-2-88910-062-0

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 55: Winding wires.

The text of this amendment is based on the following documents:

CDV	Report on voting
55/1140/CDV	55/1174/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

5 Test specimens

5.1.1 Enamelled round wire with a nominal conductor diameter of 0,800 mm up to and including 1,500 mm

Replace the title and text of this subclause by the following:

5.1.1 Enamelled round wire with a nominal conductor diameter of 0,224 mm up to and including 2,65 mm

The grade of insulation used for determining the thermal index shall be grade 2 or grade 2B for self-bonding winding wires.

Wire sizes 0,315 mm and 0,28 mm are permitted for use when the specification size range is limited to 0,50 mm and finer.

NOTE For round enamelled winding wires, in order to avoid undue fragility of the test specimen, experience has shown that nominal conductor diameters of 0,800 mm up to and including 2,65 mm are generally found convenient to handle and test.

Withdrawn
IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010

Replace the existing Table 1 by the following new Table 1:

Table 1 – Force and number of twists for specimens

Nominal diameter mm		Force applied to wire pairs N	Number of twists per 125 mm
Over	Up to and including		
0,224	0,25	0,85	33
0,25	0,35	1,7	23
0,35	0,50	3,4	16
0,50	0,75	7,0	12
0,75	1,05	13,5	8
1,05	1,50	27,0	6
1,50	2,15	54,0	4
2,15	2,65	108,0	3

5.3 Number of test specimens

Replace the text of this subclause by the following new text:

Experience has shown that 20 specimens without impregnation and 10 specimens with impregnation give results with an acceptable tolerance. A minimum of 10 specimens shall be used.

5.4 Specimen holder

Replace the last sentence of this subclause by the following new sentence:

The holder shall be designed for at least 10 specimens to decrease handling time.

6 Temperature exposure

Replace the eighth paragraph of this clause by the following new paragraph:

Test specimens should be exposed to a minimum of three and preferably four exposure temperatures. The lowest temperature, recommended at 20 °C above the desired thermal class, should be one which results in a time frame to failure of more than 5000 h. The highest exposure temperature must have a value of at least 100 h to be considered a valid data point. Exposure temperatures should not be more than 20 °C apart. The accuracy of the temperature index predicted from the results will increase as the exposure temperature approaches the temperature to which the insulation is exposed in service.

7 Test voltage and its application

Replace the third paragraph of this clause by the following new paragraph:

The test specimens are removed from the ovens and cooled to room temperature. Each specimen is subjected to a proof voltage according to the average thickness of the enamel as

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010
Withdrawn

specified in Table 3. For self-bonding wires, the self-bonding layer is included in the increase in diameter due to the insulation.

Annex A

Replace Table A1 by the following new Table A.1:

Table A.1 – Commonly used test temperatures in degrees Celsius and the corresponding Kelvin's with its reciprocal and reciprocal squared values

θ °C	T K	$X = 1/T\ (K^{-1})$	$X^2 = 1/T^2\ (K^{-2})$
105	378	$2{,}646 \times 10^{-3}$	$6{,}999 \times 10^{-6}$
120	393	$2{,}545 \times 10^{-3}$	$6{,}475 \times 10^{-6}$
125	398	$2{,}513 \times 10^{-3}$	$6{,}313 \times 10^{-6}$
130	403	$2{,}481 \times 10^{-3}$	$6{,}157 \times 10^{-6}$
140	413	$2{,}421 \times 10^{-3}$	$5{,}863 \times 10^{-6}$
150	423	$2{,}364 \times 10^{-3}$	$5{,}589 \times 10^{-6}$
155	428	$2{,}336 \times 10^{-3}$	$5{,}459 \times 10^{-6}$
165	438	$2{,}283 \times 10^{-3}$	$5{,}212 \times 10^{-6}$
175	448	$2{,}232 \times 10^{-3}$	$4{,}982 \times 10^{-6}$
180	453	$2{,}208 \times 10^{-3}$	$4{,}873 \times 10^{-6}$
185	458	$2{,}183 \times 10^{-3}$	$4{,}767 \times 10^{-6}$
190	463	$2{,}160 \times 10^{-3}$	$4{,}665 \times 10^{-6}$
200	473	$2{,}114 \times 10^{-3}$	$4{,}470 \times 10^{-6}$
210	483	$2{,}070 \times 10^{-3}$	$4{,}287 \times 10^{-6}$
220	493	$2{,}028 \times 10^{-3}$	$4{,}114 \times 10^{-6}$
225	498	$2{,}008 \times 10^{-3}$	$4{,}032 \times 10^{-6}$
230	503	$1{,}988 \times 10^{-3}$	$3{,}952 \times 10^{-6}$
240	513	$1{,}949 \times 10^{-3}$	$3{,}800 \times 10^{-6}$
250	523	$1{,}912 \times 10^{-3}$	$3{,}656 \times 10^{-6}$
260	533	$1{,}876 \times 10^{-3}$	$3{,}520 \times 10^{-6}$
270	543	$1{,}842 \times 10^{-3}$	$3{,}392 \times 10^{-6}$
280	553	$1{,}808 \times 10^{-3}$	$3{,}270 \times 10^{-6}$
300	573	$1{,}745 \times 10^{-3}$	$3{,}048 \times 10^{-6}$
320	593	$1{,}686 \times 10^{-3}$	$2{,}844 \times 10^{-6}$
Calculations for X^2 are based on non-rounded values.			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010
Withdrawn

Annex B
(normative)

Correlation coefficient

Replace the existing Annex B by the following new Annex B:

Annex B
(normative)

Correlation coefficient

The correlation coefficient *r* is a measure of the amount of relationship between variables.

When *r* = 1,0, a perfect association between the variable exists, and when *r* = 0, a completely random relation exists.

$$r = \sqrt{\frac{aY + bXY - N(Avg\,Y)^2}{Y^2 - N(Avg\,Y)^2}}$$

where

N is the number of test temperatures used, and
X, Y are the variables.

Using the example data in Table AII in Annex A:

$$\text{Correlation Coefficient – Linearity } r = \sqrt{\frac{a\Sigma Y + b\Sigma XY - N(Avg\,Y)^2}{\Sigma Y^2 - N(Avg\,Y)^2}} = 0.996$$

If the correlation coefficient *r* is equal to or greater than 0,95, the data is said to be linear and the data points will be reasonably close to a straight line.

In the event that the correlation coefficient is less than 0,95, the data is said to be nonlinear and additional tests at other test temperatures are required. It is recommended that the new temperature point be 10 °C below the previous lowest temperature point.

When recalculating the temperature index and correlation coefficient, it is permissible for one temperature point to be deleted, starting with the highest temperature, provided that there are still three valid data points.

The data will be linear if the thermal deterioration of the film insulated wire or the varnished film insulated wire appears as one chemical reaction. Nonlinearity possibly indicates the following:

1) two or more reactions that have different activation energies (slopes) are predominant at different temperatures within the testing range; or
2) errors have been introduced through the sampling technique or the testing procedure, or both.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010
Withdrawn

It shall be noted that nonlinear results provide useful engineering data when plotted on the thermal endurance graph even when the data cannot be extrapolated appropriately to give a temperature index (TI).

_____

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010
Withdrawn

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010
Withdrawn

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CDV	Rapport de vote
55/1140/CDV	55/1174/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

---

5 Eprouvettes d'essai

5.1.1 Fil de section circulaire émaillé de diamètre nominal du conducteur supérieur à 0,800 mm et inférieur ou égal à 1,500 mm

Remplacer le titre et le texte de ce paragraphe par ce qui suit:

5.1.1 Fil de section circulaire émaillé de diamètre nominal du conducteur de 0,224 mm jusqu'à et y compris 2,65 mm

Le grade de l'isolant utilisé pour la détermination de l'indice de température doit être le grade 2 ou grade 2B pour les fils de bobinage avec une couche thermo-adhérente.

Les dimensions de fil 0,315 mm et 0,28 mm peuvent être utilisées lorsque la gamme de dimensions spécifiée est limitée à 0,50 mm ou inférieur.

NOTE Pour les fils de bobinage émaillés de section circulaire, afin d'éviter une fragilité excessive de l'éprouvette, l'expérience a montré que les diamètres nominaux de conducteurs de 0,800 mm jusqu'à et y compris 2,65 mm conviennent généralement aux manipulations et à l'essai.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010
Withdrawn

Remplacer le Tableau 1 existant par le nouveau Tableau 1 suivant:

Tableau 1 – Force et nombre de tours des éprouvettes

Diamètre nominal mm		**Force totale appliquée sur les deux fils** N	**Nombre de tours par 125 mm**
De	Jusqu'à et y compris		
0,224	0,25	0,85	33
0,25	0,35	1,7	23
0,35	0,50	3,4	16
0,50	0,75	7,0	12
0,75	1,05	13,5	8
1,05	1,50	27,0	6
1,50	2,15	54,0	4
2,15	2,65	108,0	3

5.3 Nombre d'éprouvettes

Remplacer le texte de ce paragraphe par le nouveau texte suivant:

L'expérience a montré que 20 éprouvettes sans imprégnation et 10 éprouvettes avec imprégnation donnent des résultats avec une tolérance acceptable. Un minimum de 10 éprouvettes doit être utilisé.

5.4 Porte-éprouvettes

Remplacer la dernière phrase de ce paragraphe par la nouvelle phrase suivante:

Le support doit être conçu pour au moins 10 éprouvettes, pour réduire le temps des manipulations.

6 Température d'exposition

Remplacer le huitième alinéa de cet article par le nouvel alinéa suivant:

Il convient que les éprouvettes d'essai soient exposées à trois au moins, ou mieux à quatre températures. Il convient que la plus basse température, laquelle est recommandée supérieure de 20 °C à la classe thermique souhaitée, conduise à un temps jusqu'à défaillance de plus de 5 000 h. Il faut que la plus haute température d'exposition conduise à un temps d'au moins 100 h pour être considérée comme une donnée valide. Il convient que les températures d'exposition ne diffèrent pas de plus de 20 °C les unes des autres. La précision de l'indice de température déduit des résultats augmentera au fur et à mesure que la température d'exposition se rapprochera de la température à laquelle l'isolation sera exposée en service.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010
Withdrawn

7 Tension d'épreuve et son application

Remplacer le troisième alinéa de cet article par le nouvel alinéa suivant:

Les éprouvettes sont retirées des étuves et refroidies à la température ambiante. Chaque éprouvette est soumise à une tension d'épreuve qui est en fonction de l'épaisseur moyenne du film isolant, comme spécifié dans le Tableau III. Pour les fils avec une couche thermo-adhérente, la couche thermo-adhérente est comprise dans l'accroissement de diamètre dû à l'isolant.

Annexe A

Remplacer le Tableau A1 par le nouveau Tableau A.1 suivant:

Tableau A.1 – Températures d'essai habituelles en degrés Celsius et en Kelvins correspondants, avec l'inverse et l'inverse du carré

θ °C	T K	$X = 1/T\ (K^{-1})$	$X^2 = 1/T^2\ (K^{-2})$
105	378	$2{,}646 \times 10^{-3}$	$6{,}999 \times 10^{-6}$
120	393	$2{,}545 \times 10^{-3}$	$6{,}475 \times 10^{-6}$
125	398	$2{,}513 \times 10^{-3}$	$6{,}313 \times 10^{-6}$
130	403	$2{,}481 \times 10^{-3}$	$6{,}157 \times 10^{-6}$
140	413	$2{,}421 \times 10^{-3}$	$5{,}863 \times 10^{-6}$
150	423	$2{,}364 \times 10^{-3}$	$5{,}589 \times 10^{-6}$
155	428	$2{,}336 \times 10^{-3}$	$5{,}459 \times 10^{-6}$
165	438	$2{,}283 \times 10^{-3}$	$5{,}212 \times 10^{-6}$
175	448	$2{,}232 \times 10^{-3}$	$4{,}982 \times 10^{-6}$
180	453	$2{,}208 \times 10^{-3}$	$4{,}873 \times 10^{-6}$
185	458	$2{,}183 \times 10^{-3}$	$4{,}767 \times 10^{-6}$
190	463	$2{,}160 \times 10^{-3}$	$4{,}665 \times 10^{-6}$
200	473	$2{,}114 \times 10^{-3}$	$4{,}470 \times 10^{-6}$
210	483	$2{,}070 \times 10^{-3}$	$4{,}287 \times 10^{-6}$
220	493	$2{,}028 \times 10^{-3}$	$4{,}114 \times 10^{-6}$
225	498	$2{,}008 \times 10^{-3}$	$4{,}032 \times 10^{-6}$
230	503	$1{,}988 \times 10^{-3}$	$3{,}952 \times 10^{-6}$
240	513	$1{,}949 \times 10^{-3}$	$3{,}800 \times 10^{-6}$
250	523	$1{,}912 \times 10^{-3}$	$3{,}656 \times 10^{-6}$
260	533	$1{,}876 \times 10^{-3}$	$3{,}520 \times 10^{-6}$
270	543	$1{,}842 \times 10^{-3}$	$3{,}392 \times 10^{-6}$
280	553	$1{,}808 \times 10^{-3}$	$3{,}270 \times 10^{-6}$
300	573	$1{,}745 \times 10^{-3}$	$3{,}048 \times 10^{-6}$
320	593	$1{,}686 \times 10^{-3}$	$2{,}844 \times 10^{-6}$
Les calculs pour X^2 sont basés sur les valeurs non arrondies.			

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60172:1987/AMD2:2010
Withdrawn